### 01;09 Спектральные свойства интерференционных СВЧ фильтров на основе скрещенных решеток-поляризаторов

© А.В. Аржанников, С.А. Кузнецов, С.Л. Синицкий

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия e-mail: sakuzn@inp.nsk.su

(Поступило в Редакцию 23 января 2002 г.)

Приведены результаты аналитического рассмотрения и компьютерных расчетов спектральных свойств интерференционных СВЧ фильтров нового типа. Фильтр представляет собой набор плоскопараллельных решеток-поляризаторов, составленных из линейных проводников, ориентация которых в соседних решетках выбирается специальным образом. Рассмотрение проведено в предположении об идеальности поляризационных свойств решеток.

#### Введение

Решетки-поляризаторы, составленные из линейных проводников, находят широкое применение в СВЧ технике миллиметровых и субмиллиметровых волн. В частности, такие решетки успешно использовались в качестве зеркал микроволновых интерферометров Фабри–Перо (ИФП) [1–5].

В традиционной схеме микроволнового ИФП ориентация проводников в зеркалах-решетках выбирается одинаковой, что позволяет применять к такому интерферометру теорию оптического ИФП. Так, относительная ширина полосы прозрачности  $\Delta\lambda/\lambda$  заданного интерференционного порядка *m* однозначно определяется энергетическими коэффициентами отражения  $R_1$ ,  $R_2$  зеркал ИФП [6]

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{1-R}{m\pi\sqrt{R}},\tag{1}$$

где  $R = \sqrt{R_1 R_2}$ .

Выражение (1) показывает, что изменение величины  $\Delta\lambda/\lambda$  при сохранении значения *m* может осуществляться только путем замены зеркал ИФП на зеркала с другими коэффициентами отражения. В случае, когда микроволновый ИФП эксплуатируется в режиме фильтра с варьируемой шириной полосы пропускания, указанная замена зеркал-решеток вызывает значительные неудобства. С одной стороны, это связано с необходимостью переюстировки системы, а с другой — с тем, что приходится иметь в наличии большое число решеток с различными коэффициентами отражения.

Для устранения указанного выше недостатка мы предлагаем использовать в схеме многолучевого интерферометра (интерференционного фильтра) плоскопараллельные решетки-поляризаторы со скрещенным направлением проводников одной решетки по отношению к проводникам в другой. Преимущество использования интерференционных фильтров на скрещенных решетках состоит в возможности плавного варьирования их спектральных свойств за счет изменения углов скрещенности решеток без замены последних. В настоящей работе приведены результаты расчета спектральных свойств интерференционных СВЧ фильтров для случая решеток с идеальными поляризационными свойствами. Расчеты выполнены на базе методов, развитых нами в работе [7].

### Постановка задачи

Рассмотрим общий случай интерференционного фильтра, состоящего из N плоскопараллельных произвольно скрещенных решеток из линейных проводников (рис. 1). Пронумеруем решетки последовательно от 1 до N слева направо. Введем декартову систему координат XYZ, в плоскости XOY которой лежат проводники 1-й решетки, а ось OZ направлена в сторону возрастания порядкового номера решеток. Обозначим через  $d_n$  расстояние между решетками под номерами n и n + 1. Ориентацию проводников n-й решетки будем характеризовать углом  $\alpha_n \in [0, \pi]$ , отсчитываемым от оси OX против часовой стрелки. Поскольку свойства фильтра зависят от относительных углов скрещенности решеток, то положим для определенности, что угол ориентации 1-й решетки  $\alpha_1$ фиксирован и равен  $\pi/2$ .

В дальнейшем будем считать, что решетки являются идеальными поляризаторами излучения. Это означает, что амплитудные коэффициенты пропускания и отражения решеток для *E*- и *H*-поляризованных волн соответственно равны

$$\tau^{E} = 0, \quad \rho^{E} = -1, \quad \tau^{H} = 1, \quad \rho^{H} = 0.$$
 (2)

Физически равенства (2) соответствуют условию бесконечной малости периода расположения проводников в решетках по сравнению с длиной волны падающего излучения и идеальной проводимости материала проводников [8].

Пусть на фильтр из области Z < 0 по нормали к поверхности первой решетки падает плоская монохроматическая волна амплитуды  $E_0$ , модуль волнового вектора которой равен k. В дальнейшем падающую



**Рис. 1.** Принципиальная схема интерференционного СВЧ фильтра, состоящего из N произвольно скрещенных решеток.

волну будем считать *H*-поляризованной относительно первой решетки (рис. 1). В указанной системе координат ее вектор Джонса имеет вид

$$\mathbf{E}_0 = egin{pmatrix} E_0 \ 0 \end{pmatrix}.$$

Данный выбор направления поляризации падающего излучения соответствует условиям (2). Отметим, что он принципиально отличен от выбора поляризации в случае традиционного микроволнового ИФП, работающего на *E*-поляризованной волне.<sup>1</sup> Требуется найти энергетический коэффициент пропускания фильтра. Для пренебрежения дифракционными эффектами будем считать, что апертура решеток, а также ширина фронта падающего излучения много больше длины волны  $\lambda$ .

### Спектральные свойства фильтра из двух скрещенных решеток

Расчет по методу рекуррентных формул [7] матрицы пропускания  $T_2^{\rightarrow}$  двухрешеточного фильтра с учетом равенства (2) приводит к следующему выражению:

$$T_2^{\rightarrow} = \frac{(1 - e^{2i\gamma})e^{i\gamma}\sin\alpha}{(1 - e^{2i\gamma}\sin^2\alpha)} \begin{pmatrix} \sin\alpha & \vdots & 0\\ \dots & \dots & \dots\\ -\cos\alpha & \vdots & 0 \end{pmatrix},$$

где  $\gamma = kd, d \equiv d_1, \alpha \equiv \alpha_2.$ 

Напомним, что направление стрелки в верхнем индексе матрицы указывает на то, что *z*-компонента волнового вектора падающей волны совпадает по направлению с осью *OZ*.

Величина энергетического коэффициента пропускания фильтра для *Н*-поляризованной волны находится из

Журнал технической физики, 2002, том 72, вып. 9

выражения  $\hat{T}_2^{\rightarrow} = |T_{2,11}^{\rightarrow}|^2 + |T_{2,21}^{\rightarrow}|^2$ . Результат вычислений дает следующую формулу:

$$\hat{T}_2^{\rightarrow} = \frac{4\sin^2\gamma}{\cos^2\alpha \operatorname{ctg}^2\alpha + 4\sin^2\gamma}.$$
(3)

На рис. 2 приведены зависимости величины  $\hat{T}_2^{\rightarrow}$  от параметра  $\gamma/\pi$  для различных углов ориентации  $\alpha$  проводников второй решетки.

Положение минимумов и максимумов функции  $\hat{T}_2^{\rightarrow}(\gamma)$  определяется условиями

min : 
$$\gamma = n\pi$$
, rge  $n = 0, 1, 2, ...;$  max :  $\gamma = n\pi + \pi/2$ .

Последние соответствуют следующим значениям длин волн:

$$\lambda_n^{\min} = \frac{2d}{n}, \quad \lambda_m^{\max} = \frac{2d}{n+1/2}$$

В точках минимума прозрачность фильтра равна нулю независимо от величины угла  $\alpha$ . В точках максимума коэффициент пропускания равен  $\hat{T}_{2 \max} = 4 \sin^2 \alpha / (1 + \sin^2 \alpha)^2$ . При изменении угла  $\alpha$  от  $\pi/2$  до 0 (или от  $\pi/2$  до  $\pi$ ) функция  $\hat{T}_{2 \max}^{-1}(\alpha)$  монотонно убывает от единичного значения до нулевого.

Отметим, что кривые пропускания при любом угле  $\alpha$  имеют широкие интерференционные максимумы. Таким образом, создание узкополосного пропускающего интерференционного фильтра на основе двух идеальных решеток-поляризаторов представляется невозможным. Тем не менее достоинством данной структуры можно считать возможность выделения узких спектральных полос непрозрачности (отражения) требуемой ширины при угле  $\alpha$ , близком к  $\pi/2$  (т.е.  $\alpha_2 \cong \alpha_1$ ). При этом коэффициент пропускания фильтра практически во всей спектральной области дисперсии близок к единице.

Исходя из выражения (3), лекго показать, что для случая, когда угол  $\delta$  отстройки решеток от параллельной ориентации мал ( $|\delta| = |\pi/2 - \alpha| \ll 1$ ), относительная

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В случае *Е*-поляризации падающая на рассматриваемый фильтр волна полностью отразится от его первой решетки и последующие не окажут никакого влияния на прохождение волны через фильтр.



**Рис. 2.** Спектральные кривые пропускания двух решеточного фильтра при различных углах  $\alpha$  ориентации второй решетки. На графиках угол  $\varepsilon$  имеет значения  $\alpha$ , если  $0 \le \alpha \le \pi/2$ , либо  $(\pi - \alpha)$ , если  $\pi/2 \le \alpha \le \pi$ . Около кривых — значения  $\varepsilon$ .

ширина полосы отражения  $\Delta \lambda / \lambda_n^{\min}$  зависит от величины  $\delta$  квадратично

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_n^{\min}} \cong \frac{p\delta^2}{n\pi}.$$

Здесь параметр p определяет уровень коэффициента отражения, по которому рассчитывается ширина полосы. Так, p = 1 для уровня 0.5 и p = 3 для уровня 0.1.

## Спектральные свойства фильтра из трех скрещенных решеток

При выполнении условия (2) матрица пропускания  $T_3^{\rightarrow}$  трехрешеточного фильтра описывается выражением

$$T_{3}^{\rightarrow} = \frac{(1 - e^{2i\gamma_{1}})(1 - e^{2i\gamma_{2}})e^{i(\gamma_{1} + \gamma_{2})}\sin(\alpha + \beta)\sin\alpha}{(1 - e^{2i\gamma_{2}}\sin^{2}(\alpha + \beta))(1 - e^{2i\gamma_{1}}\sin^{2}\alpha) - -e^{2i(\gamma_{1} + \gamma_{2})}\cos^{2}(\alpha + \beta)\cos^{2}\alpha}$$

 $\times \left( \begin{array}{c} \cdots \\ -\sin\beta \end{array}; 0 \right),$ 

где  $\gamma_1 = kd_1, \, \gamma_2 = kd_2, \, \alpha \equiv \alpha_2, \, \beta \equiv \pi/2 - \alpha_3.$ 

Вычисление энергетического коэффициента пропускания фильтра на основе выражения  $\hat{T}_{3}^{\rightarrow} = |T_{3,11}^{\rightarrow}|^2 + |T_{3,21}|^2$ приводит к следующей формуле:

$$\hat{T}_{3}^{\rightarrow} = \frac{16\sin^{2}(\alpha+\beta)\sin^{2}\alpha\sin^{2}\gamma_{1}\sin^{2}\gamma_{2}}{\chi^{2}+4\sin^{2}\gamma_{1}\sin^{2}\gamma_{2}\left[\sin^{2}(\alpha+\beta)+\sin^{2}\alpha\right]^{2}}, \quad (4)$$

где

$$\chi = \sin(\gamma_1 + \gamma_2) \left[ \cos^2(\alpha + \beta) + \cos^2 \alpha \right] + \sin(\gamma_1 - \gamma_2) \left[ \cos^2(\alpha + \beta) - \cos^2 \alpha \right].$$

Рассмотрим два возможных случая:  $\beta = 0$  и  $\beta \neq 0$ . 1) Случай  $\beta = 0$  (одинаковая ориентация крайних решеток). Условие  $\beta = 0$  позволяет привести выражение (4) к виду

$$\hat{T}_{3}^{\rightarrow} = \frac{4\sin^{2}\gamma_{1}\sin^{2}\gamma_{2}}{\operatorname{ctg}^{4}\alpha\sin^{2}(\gamma_{1}+\gamma_{2})+4\sin^{2}\gamma_{1}\sin^{2}\gamma_{2}}.$$
 (5)

На рис. 3 приведены характерные зависимости величины  $\hat{T}_3^{\rightarrow}$  от параметра  $(\gamma_1 + \gamma_2)/\pi$  при различных углах ориентации а проводников средней решетки. Можно видеть, что изменение угла α позволяет плавно варьировать как ширину полос пропускания, так и ширину полос отражения фильтра. Режим узкополосности по пропусканию реализуется в случае почти ортогональной ориентации средней решетки относительно крайних  $(\alpha \ll 1$ либо  $(\pi - \alpha) \ll 1$ ). В противоположном предельном случае, когда углы ориентации средней и крайних решеток близки ( $|\pi/2 - \alpha| \ll 1$ ), реализуется режим узкополосности по отражению. Таким образом, видно, что трехрешоточный фильтр сохраняет отмечавшееся выше достоинство фильтра из двух решеток. Обратим внимание, что значения  $T_3^{\rightarrow}$  в точках минимума и максимума остаются равными соответственно нулю и единице для любых значений а, что является следствием идеальности решеток как поляризаторов излучения.

Из выражения (5) следует, что положение минимумов и максимумов на спектральной кривой прозрачности соответствует условиям

min: 
$$\gamma_i = n_i \pi$$
, где  $n_i = 0, 1, 2, ...; j = 1, 2;$ 

max:  $\gamma_1 + \gamma_2 = m\pi$ , где  $m = 1, 2, 3, ...; m \neq n_j$ .



**Рис. 3.** Спектральные кривые пропускания трехрешеточного фильтра при различных углах  $\alpha$  ориентации средней решетки для случая  $\beta = 0$ ,  $d_1/d_2 = 0.7$ . На графиках угол  $\varepsilon$  имеет значения  $\alpha$ , если  $0 \le \alpha \le \pi/2$ , либо  $(\pi - \alpha)$ , если  $\pi/2 \le \alpha \le \pi$ , у кривых — значения  $\varepsilon$ .

Журнал технической физики, 2002, том 72, вып. 9

Отсюда находим значения длин волн в точках минимума и максимума

$$\lambda_{n_j}^{\min} = rac{2d_j}{n_j}, \ j = 1, 2; \ \ \lambda_m^{\max} = rac{2(d_1+d_2)}{m}.$$

Для отмеченных выше режимов узкополосности, которые на практике предствляют наибольший интерес, анализ выражения (5) дает следующие формулы для относительной ширины полос отражения и пропускания: а) узкополосность по отражению ( $|\delta| \ll 1$ , где  $\delta = \pi/2 - \alpha$ )

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_{n_i}^{\min}} \cong \frac{p\delta^2}{n_j \pi};\tag{6}$$

б) узкополосность по пропусканию ( $\varepsilon \ll 1$ , где  $\varepsilon = \alpha$ либо  $\varepsilon = \pi - \alpha$ )

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^{\max}} \cong \frac{4p\phi_m \varepsilon^2}{m\pi},\tag{7}$$

где

$$\phi_m = \begin{cases} \cos^2 \Delta_m, & m \text{ нечетно,} \\ \sin^2 \Delta_m, & m \text{ четно,} \end{cases}$$
 $\Delta_m = \frac{\pi m}{2} \frac{(d_1 - d_2)}{(d_1 + d_2)}.$ 

Значение стоящего в формулах (6), (7) параметра p равно единице для уровня коэффициента отражения (пропускания) 0.5 и трем для уровня 0.1.

Наличие фазового параметра  $\phi_m$  в формуле (7) означает, что значение  $\Delta\lambda/\lambda_m^{\max}$  при фиксированном порядке интерференции *m* можно регулировать не только углом скрещенности решеток, но также и расстоянием между ними. В результате значение  $\Delta\lambda/\lambda_m^{\max}$  может обращаться в нуль даже при  $\varepsilon \neq 0$ . Легко видеть, что условие  $\phi_m = 0$  выполняется в том случае, когда происходит совмещение минимумов, различающихся по индексу *j*. Резонансные значения расстояний, для которых  $\phi_m = 0$ , связаны с длиной волны в максимуме соотношениями

$$d_1=rac{m\pm l}{4}\lambda_m^{ ext{max}}, \quad d_2=rac{m\mp l}{4}\lambda_m^{ ext{max}}.$$

Здесь l — целое положительное число, четность которого совпадает с четностью m. При этом область допустимых значений l заключена в интервале от 1 до m, если m, нечетно, и от 0 до m, если m четно.

Заметим, что при практическом использовании интерференционного фильтра наибольший интерес представляет режим, при котором спектральная область свободной дисперсии фильтра максимальная. По этой причине расстояния  $d_1$ ,  $d_2$  целесообразно выбирать одинаковыми, поскольку в этом случае четные максимумы будут отсутствовать.

2) Случай  $\beta \neq 0$ . При произвольном значении угла  $\beta$ , представляющего собой угол отстройки крайних решоток от параллельной ориентации проводников, спектральные кривые пропускания трехрешеточного фильтра носят промежуточный характер между



**Рис. 4.** Зависимости максимального энергетического коэффициента пропускания (*a*) и спектрального разрешения (*b*) трехрешеточного фильтра от угла  $\varepsilon$ . У кривых — значения угла  $\beta$  (в градусах), m = 1,  $d_1/d_2 = 1$ .

рассмотренными ранее вариантами  $\beta = 0$  и  $\beta = \pi/2 - \alpha$  (последний вариант относится к случаю двухрешеточного фильтра). В связи с этим случай  $\beta \neq 0$  не содержит принципиально новых решений, за исключением того, что узкие полосы отражения могут быть получены при любом значении  $\alpha$  при условии близости ориентационных углов 2-й и 3-й решеток ( $|\pi/2 - (\alpha + \beta)| \ll 1$ ). По этой причине мы ограничимся лишь замечаниями относительно выбора оптимального значения  $\beta$ .

Как следует из формулы (4), в случае  $\beta \neq 0$  прозрачность фильтра максимальна на длинах волн, удовлетворяющих условию  $\chi = 0$ . В точках максимума коэффициент пропускания равен

$$\hat{T}_{3\max} = \frac{4\sin^2(\alpha+\beta)\sin^2\alpha}{\left[\sin^2(\alpha+\beta)+\sin^2\alpha\right]^2}.$$
(8)

Выражение (8) показывает, что в режиме узкополосности по пропусканию при  $\varepsilon \to 0$  ненулевая величина угла  $\beta$  приводит к падению максимального коэффициента прозрачности до нуля по закону  $T_{3 \max}^{\to}|_{\varepsilon \to 0} \cong 4\varepsilon^2 / \sin^2 \beta$ . Данное обстоятельство накладывает принципиальное ограничение на предельно достижимую при перестройке  $\alpha$  ширину полосы пропускания. Отсюда следует, что оптимальным вариантом при выборе значения  $\beta$  является рассмотренный ранее случай  $\beta = 0$ , для которого  $\hat{T}_{3 \max}^{\to} = 1$  при любом  $\alpha$ .

Оптимальность одинаковой ориентации крайних решеток подтверждается также расчетами относительной ширины полосы прозрачности, выражение для которой при условии  $\varepsilon$ ,  $|\beta| \ll 1$  принимает вид (ср. (7))

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^{\max}} \cong \frac{2p\phi_m[\varepsilon^2 + (\varepsilon + \beta)^2]}{m\pi}.$$
(9)

Согласно (9), минимум ширины полосы при фиксированном  $\varepsilon$  достигается при  $\beta = 0$ . Графики, представленные на рис. 4, иллюстрируют поведение  $\hat{T}_{3 \max}(\varepsilon)$  и спектрального разрешения для различных значений  $\beta$ .

# Особенности спектральных свойств сложных фильтров

Увеличение числа скрещенных решеток-поляризаторов, составляющих интерференционный фильтр, приводит к усложнению картины интерференции полей в такой структуре и появлению новых особенностей в спектре ее пропускания (отражения). По этой причине фильтр, содержащий более трех решеток, будем называть сложным интерференционным фильтром.

Помимо возможности подбора спектральных кривых пропускания (отражения) необходимой формы к достоинству сложных фильтров следует также отнести возможность получения полос пропускания (отражения) со значительно более крутым фронтом, чем в случае двух- и трехрешеточных фильтров. Проиллюстрируем указанные особенности ложных фильтров на примере фильтра из пяти решеток.

Рассматривая пятирешеточный фильтр как последовательную комбинацию двух трехрешеточных фильтров оптимальной конфигурации, начнем с анализа случая  $d_1 = d_2 = d_3 = d_4 \equiv d, \, \alpha_1 = \alpha_3 = \alpha_5 = \pi/2, \, \alpha_2, \, \alpha_4 - d_4 \equiv d_5 \equiv d_4 \equiv d_5 \equiv d_4 \equiv d_4 \equiv d_4 \equiv d_4 \equiv d_4 \equiv d_4 \equiv d_5 \equiv d_4 \equiv d_5 \equiv d_4 \equiv d_5 \equiv d_4 \equiv d_4 \equiv d_4 \equiv d_4 \equiv d_5 \equiv d_5 \equiv d_5 \equiv d_5 \equiv d_4 \equiv d_4 \equiv d_5 \equiv d_4 \equiv d_5 \equiv d_5$ свободные параметры. Расчет показывает, что в спектре пропускания такого сложного фильтра симметрично по обе стороны от основных максимумов, соответствующих условию  $\gamma = m\pi$  ( $\gamma = 4\pi d/\lambda, m = 1, 3, 5, ...$ ), присутствует еще по одному дополнительному. Их положение и амплитуда зависят от углов ориентации 2-й и 4-й решеток. Наибольший интерес представляет собой  $\alpha_2 = \alpha_4 \equiv \alpha$ , для которого амплитуда дополнительных максимумов равна единице, а крутизна их фронтов максимальна (рис. 5). В этом режиме в диапазоне углов  $\pi/4 < \alpha < 3\pi/4$  прозрачность фильтра в точках провала между основным и дополнительным максимумами (обозначаемая далее как  $\hat{T}_{5\,\mathrm{min}}^{\rightarrow}$ ) не опускается ниже 0.86. Это позволяет рассматривать пятирешеточный фильтр



**Рис. 5.** Спектральные кривые пропускания пятирешеточного фильтра (сплошные кривые) и трехрешеточного фильтра (штриховые) при различных значениях угла  $\varepsilon$  (у кривых).



**Рис. 6.** Трансформация спектральных кривых пропускания пятирешеточного фильтра при изменении угла ориентации 3-й решетки для случая  $\alpha = \pi/6$ . Около кривых — значения  $\beta$ .

как полосовой с шириной полосы пропускания, приближенно равной спектральному интервалу  $\Delta\Gamma$  между дополнительными максимумами.

Сравнение спектральных кривых прозрачности трехи пятирешеточных фильтров показывает, что пятирешеточный фильтр имеет явное преимущество при работе в широкополосном режиме ( $\varepsilon \sim 1$ ), когда трехрешеточный фильтр выделяет "полосы" с сильно заваленным фронтом (рис. 5). При переходе в узкополосный режим ( $\varepsilon \rightarrow 0$ ) выигрыш в крутизне фронта для пятирешеточного фильтра также сохраняется, однако в этом случае значение  $\hat{T}_{5 \min}^{\rightarrow}$  падает до нуля, так что рассматриваемый сложный фильтр выделяет три близко стоящие полосы вместо одной. Последний эффект является, как правило, нежелательным, и для его устранения можно предположить альтернативный режим эксплуатации пятирешеточного фильтра.

Анализ показывает, что варьирование величины  $\Delta\Gamma$  при сохранении требования  $\hat{T}_{5\,\text{min}}^{\rightarrow} \cong 1$  может осуществляться путем изменения угла ориентации 3-й решетки  $\alpha_3$ . При этом величину угла  $\alpha$  следует выбирать такой, чтобы обеспечить приемлемые значения  $\hat{T}_{5\,\text{min}}^{\rightarrow}$  и крутизну фронта полосы. Таким образом, рассмотрим следующую конфигурацию пятирешеточного фильтра:  $d_1 = d_2 = d_3 = d_4 \equiv d, \alpha_1 = \alpha_5 = \pi/2, \alpha_2 = \alpha_4 \equiv \alpha, \alpha_3 \equiv \pi/2 - \beta$ . Расчет энергетического коэффициента пропускания в этом случае приводит к формуле

$$T_{5}^{\neg} = T_{5}^{\neg}$$

$$= \left| \frac{(1 - e^{i\gamma})\sin^{2}\alpha\sin^{2}(\alpha + \beta)}{[1 + e^{i\gamma}\cos^{2}\alpha][1 + e^{i\gamma}(1 + e^{i\gamma})\cos^{2}\alpha + e^{i\gamma}\cos 2(\alpha + \beta)]} \right|_{(10)}^{2}$$

где  $\gamma = 4\pi d/\lambda$ .

Рис. 6 иллюстрирует поведение спектральных кривых прозрачности фильтра при изменении угла β.

В широкополосном режиме ( $|\phi| \sim 1$ , где  $\phi = \alpha + \beta$ либо  $\phi = \pi - (\alpha + \beta)$ ) основной вклад в ширину полосы дает спектральный интервал  $\Delta\Gamma$  между дополнительными максимумами. Согласно (10), величина  $\Delta\Gamma$ , выраженная в единицах  $\gamma$ , определяется формулой

$$\Delta\Gamma = 2\left(\pi - 2\arccosrac{\sqrt{D}}{2|\coslpha|}
ight),$$

где  $D = 2\sin^2(\alpha + \beta) - \sin^2\alpha \left[\sin^2(\alpha + \beta) + \sin^2\alpha\right].$ 

Значение  $\Delta\Gamma$  максимально в случае равной ориентации 2-й (4-й) и 3-й решеток ( $\alpha + \beta = \pi/2$ ). При приведении 3-й решетки в скрещенное положение относительно 2-й (4-й) величина  $\Delta\Gamma$  уменьшается, и при условии D = 0 происходит совмещение основного и дополнительных максимумов. Режим узкополосности реализуется в случае  $|\phi| \ll 1$ , т.е. когда относительный угол скрещенности 2-й (4-й) и 3-й решеток близок к  $\pi/2$ . В этом режиме D < 0 и выражение для относительной ширины полосы прозрачности имеет вид

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_m^{\max}} \cong \frac{4p}{m\pi} \left(\frac{\phi}{\sin\alpha}\right)^2$$

### Заключение

Проведено теоретическое исследование спектральных свойств интерференционных фильтров, состоящих из нескольких скрещенных решеток-поляризаторов. В результате получены зависимости формы и ширины полосы пропускания (отражения) от углов скрещенности решеток, что открывает возможность практического использования таких фильтров.

Показано, что простейший фильтр из двух решетокполяризаторов позволяет выделять узкие полосы только на отражении. В свою очередь, фильтр из трех решеток обладает возможностью выделения узких полос как на отражении, так и на пропускании. В случае еще более сложных фильтров указанные для трехрешеточных фильтров достоинства сохраняются. Более того, появляется дополнительная возможность варьирования крутизны фронтов и формы спектральной кривой пропускания (отражения) фильтра. В данной работе эта возможность подробно проанализирована для случая фильтра из пяти решеток.

Исследование проведено в приближении идеальных поляризационных свойств решеток и отсутствия угловой расходимости излучения. В рамках этого приближения значение предельно достижимого спектрального разрешения  $(\lambda/\Delta\lambda)_{max}$  при оптимальной взаимной ориентации решеток фильтра оказывается ограниченным лишь дифракционными эффектами из-за конечных поперечных размеров решеток. Дополнительное ограничение сверху величины  $(\lambda/\Delta\lambda)_{max}$  связано с отклонением от оптимального значения во взаимном положении решеток по углу. Например, для случая трехрешеточного фильтра

угловая расстройка в ориентации крайних решеток величиной 1° приводит к значению  $(\lambda/\Delta\lambda)_{max} \cong 10^3$  при коэффициенте прозрачности в максимуме пропускания около 70% (рис. 4).

Учет влияния на спектральные свойства фильтров неидеальности работы решеток в качестве поляризаторов излучения, а также угловой расходимости падающего на фильтр излучения будет сделан в следующей работе.

#### Список литературы

- [1] Королев Ф.А., Гриднев В.А. // Опт. и спектр. 1964. Т. 16. Вып. 2. С. 335–340.
- [2] Чернетский А.В., Зиновьев О.А., Козлов О.В. Аппаратура и методы плазменных исследований. М.: Атомиздат, 1965.
- [3] Виноградов Е.А., Дианов Е.М., Ирисова Н.А. // Письма в ЖЭТФ. 1965. Т. 2. Вып. 7. С. 323–326.
- [4] Балаханов В.Я., Русанов В.Д., Стриганов А.Р. // ЖТФ. 1965. Т. 35. Вып. 1. С. 127–131.
- [5] Багдасаров А.А., Бузанкин В.В., Васин Н.Л. и др. // Диагностика плазмы. Сб. статей. Вып. 4(1). М.: Энергоиздат, 1981. С. 141–146.
- [6] Розенберг Г.В. Оптика тонкослойных покрытий. М.: ГИФМЛ, 1958.
- [7] Аржанников А.В., Кузнецов С.А. // ЖТФ. 2001. Т. 71. Вып. 12. С. 1–5.
- [8] Шестопалов В.П., Литвиненко Л.П., Масалов С.А., Сологуб В.Г. Дифракция волн на решетках. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1973.